



Integrationspattern – Übersicht und Systematisierung

Seminar Integration Betrieblicher Informationssysteme
WS09/10, 04.12.2009, S 312

Johannes Schmidt

mam08gxr@studserv.uni-leipzig.de

Gliederung

- **Aufgabenstellung**
- **Aufbau der Arbeit**
- **Literatur**

Aufgabenstellung

- **Patterns für die Integration hilfreich**
- **Systematisierung von Integrationspattern**
 - ▶ Was genau macht ein Pattern aus?
 - ▶ Patterns im Kontext der Integration
 - ▶ Welcher Aufbau der Patterns bietet sich für die Systematisierung an? Haben Integrationspattern besondere Eigenschaften / Anforderungen?
 - ▶ Was ist ein Patternsystem?

Aufbau der Arbeit

- **Auseinandersetzung mit der Bedeutung und dem Aufbau von Patterns**
- **Abgrenzung der Integrationspattern**
- **Detaillierte Analyse ausgewählter Pattern**
 - ▶ Abteilung von Eigenschaften
 - ▶ Betrachtung von unterschiedlichen Ebenen
- **Systematisierung und Generalisierung dieser Eigenschaften**
- **Ziel: Empfehlungen für ein Patternsystem**
- **Ausblick: Weitere Patterns einordnen und mit Requirements erweitern**

Literatur

- **Andersson und Johnson 2001** Andersson, J. ; Johnson, P.: Architectural integration styles for large-scale enterprise software systems. In: Proceedings of the 5th IEEE International Conference on Enterprise Distributed Object Computing IEEE Computer Society (Veranst.), 2001, S. 224
- **Lutz 2000** Lutz, J.C.: EAI architecture patterns. In: EAI Journal 1 (2000), Nr. 3
- **Schwinn und Schelp 2003** Schwinn, A. ; Schelp, J.: Data integration patterns. In: Business Information Systems, Colorado Springs (2003)
- **Schwinn 2006** Schwinn, Alexander: Entwurfsmusterbasierter Ansatz zur Systematisierung von Applikationsbeziehungen im Business Engineering. In: Schelp, Joachim (Hrsg.) ; Winter, Robert (Hrsg.): Integrationsmanagement - Planung, Bewertung und Steuerung von Applikationslandschaften, Springer, 2006, S. 31-59
- **Salingaros 2008** Salingaros, N.A.: The structure of pattern languages. In: arq: Architectural Research Quarterly 4 (2008), Nr. 02, S. 149-162